

研究タイトル: 情報システムの信頼性に関する研究



氏名: 大豆生田 / 利章 E-mail: mame@ice.gunma-ct.ac.jp

職名: 准教授 学位: 博士(工学)

所属学会・協会: 応用物理学会、電子情報通信学会、IEEE Computer Society

キーワード: ディペンダブルシステム, テスタビリティ, 論理設計, 故障, 信頼性

技術相談
提供可能技術:
・情報システムの故障に対する論理的・物理的モデルの作成および解析
・
・

研究内容: 集積回路のテスト容易化設計・テスタビリティ解析、単電子論理回路の故障解析

1. 従来技術

- 1) 論理設計後にテストパターン作成
- 2) パラメータ変動を仮定しない単電子論理回路解析

2. 従来技術に対する優位性

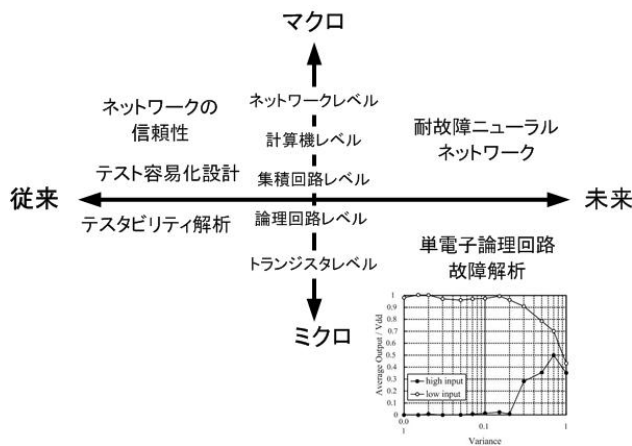
- 1) 論理設計とテストパターン作成の同時進行
- 2) パラメータ変動を考慮した単電子論理回路の動作解析

3. 予想される応用分野

- ・集積回路の設計期間・テストコストの削減, 歩留まりの向上
- ・情報システムの信頼性向上

4. 発表論文

“単電子インバータに対するパラメータ変動の影響”, 信学論 C, Vol.J94-C, no.7, pp.184-192, July 2011.



提供可能な設備・機器:

名称・型番(メーカー)	